

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成31年1月31日(2019.1.31)

【公開番号】特開2018-119991(P2018-119991A)

【公開日】平成30年8月2日(2018.8.2)

【年通号数】公開・登録公報2018-029

【出願番号】特願2018-90906(P2018-90906)

【国際特許分類】

G 01 B 9/02 (2006.01)

G 01 B 11/00 (2006.01)

G 01 J 9/02 (2006.01)

【F I】

G 01 B 9/02

G 01 B 11/00 G

G 01 J 9/02

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月14日(2018.12.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記装置は、前記測定ビームと前記少なくとも部分的に反射された測定ビームとのビーム経路において物体と第1の検出器との間に配置された第1のレンズユニットを含み、前記レンズユニットの開口数は0.1以上であることを特徴とする請求項1に記載の光干渉測定装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

前記第1の検出器によってヘテロダイン測定が行われるように構成され、その際、周波数シフタが、測定ビームとすべての参照ビームの間の周波数シフトを行うように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の光干渉測定装置。